

4-PARA 합성시험을 위한 설비 개조

The Modification of Synthetic Test Equipment for 4-Para
Synthetic Test

신 대 승	한국전기연구소	책임연구원
박 동 육	한국전기연구소	선임연구원
박 경 업	한국전기연구소	연구원
류 형 기	한국전기연구소	연구원

예정이다.

1. 서론

IEC(International Electrotechnical Commission)

Publication 56에 따르면 계통고장 제거시에 발생하는
제기전압을 2-Parameter(이하 2P)와 4-Parameter(이하
4P)로 규정하고 있다. 특히 100KV급 이상에 대해서는
원칙적으로 4P를, 대안으로 2P를 제시하고 있다. 그런데
당 연구소의 기존 합성시험 설비는 2P 설비로 구성되어 있
으며 국내 유일의 설비로서 좀더 규격에 충실한 시험의 필
요성이 높아져 362KV 40KA Half-pole 합성시험까지 가
능한 4P 합성설비를 검토하였다.

2. 규정 제기전압

1981년에 발표된 IEC 56-2 및 56-4에 의하면 100KV급
이하의 계통이나 100KV급 이상의 계통중에서도 단락전류가
그점에서의 최대 단락전류에 비해 상대적으로 작으면서 변
압기를 통해 공급될 경우는 제기전압(Transient Recovery Voltage : 이하 TRV) 파형이 단일주파수 진동형태로
나타나고 이는 그림 1과 같은 2P로 표현 가능하다. 또한
100KV급 이상의 계통중에서 단락전류가 그점에서의 최대
단락전류에 비해 상대적으로 큰 경우의 TRV 파형은 복주파
수 진동형태로 나타나며 이는 그림 2와 같은 4P 형태로 표
현된다. 위와 같은 근거에 따라 각 차단기의 단락시험 체
무 1 및 100KV급 이하의 모든 차단기에 대해서는 2P법에의
한 차단시험을 실시하고 위의 경우를 제외한 모든 차단시험
은 4P법에 의해 시험하도록 규정되어 있고 대안으로 2P법에
의한 시험도 허용하고 있다. 그러나 그림 2의 출진 부분이
4P보다 피시품에 가혹한 조건이 되기 때문에 대부분에서 절
연파괴가 일어났을 경우에는 4P 시험을 실시해야 하고 국내
에서는 시험이 이때까지는 불가능했다. 따라서 현재 당
연구소에서 보유중인 2P 합성시험 설비를 부분 개조하여
4P 합성시험을 일부 실시하였고 추가 설비를 구입 보완할

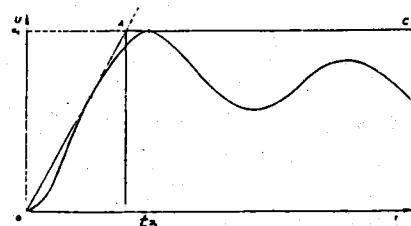


그림 1 2P TRV

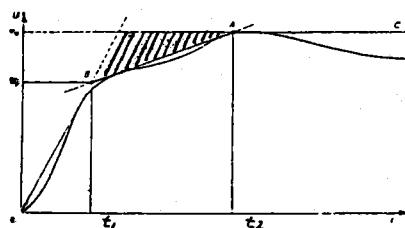


그림 2 4P 및 2P TRV 비교

3. 4P 시험 회로와 특성

아직 IEC에 의해 공인된 시험회로는 없으나 각 연구소
또는 시험소에서 여러 가지 회로를 제안하고 있는데 대표적으
로 i) Weil 회로 ii) SLF 모의선로를 이용한 회로
iii) Zajie를 적용한 회로 iv) 주파수 변경회로
v) 3전원법 vi) W/H 제안회로 등이 있으며 회로 및
그 특성은 별첨 표 1과 같다.

4. 회로 선정

표 1에서 볼 수 있듯이 현재의 당 연구소 합성 설비실의
개조없이 362KV 1/2점절까지 시험할 수 있는 유일한 회로
는 Weil 회로 뿐이다. 그러나 해외 및 국내 종전기업체
가 계획하고 있는 765KV 1/2점절 362KV 1점절 차단기에
대한 4P 합성시험을 위해서는 전체적인 설비의 개조 및 보
완이 필요할 것이며 이에 따른 연구가 진행중에 있으나 금
번 연구는 765KV 1/2 점절 시험설비 설치까지의 과정적인

회로에 대한 연구로서 Weil 회로를 선정하였고 이 회로에 대한 특성을 정밀하게 분석하였다.

순간 회로명	형 式	상이용량	회로정수 계산	제작	설계값과 단위	16.2KV 1/2길 시험적합 여부	기별
1. Weil 회로	x	o	o	o	o	o	o
2. A-B 회로	x	x	o	x	x	x	x
3. C-E 회로	x	x	o	x	x	x	x
4. 톨시아 회로	x	x	o	x	x	x	o
5. DeM-Aharon 회로	x	x	o	x	x	x	x
6. 9단기 - 1기로	o	x	o	x	x	x	x
7. cext 회로	o	o	o	x	x	x	o
8. 주파수 변환 회로	x	o	x	x	x	x	o
9. AC-DC전환	o	o	x	x	x	o	o
10. 7단기-3회전형	o	o	x	x	x	o	o
11. W/V 회로	o	o	x	x	x	o	o
12. 미지기 - 2기로	o	o	x	x	x	o	o

** 한 정기 전 **

* 상이 용량 : TRV 주파수에 따른 상이용량의 유키센트로 전자측의 유크 누드

* 회로정수 계산 : Computer로 계산하는 경우

* 제작 : 선형회로호에서 gap이나 차단기의 접점이 2개 이상이면 누드 단정

* 설계값과 단위 : 본래의 설계의 전자측이 원단면 회로 용역인 36.3KV 1/2길 시험적합

* 16.2KV 1/2길 사용기술 계획 : 설계와 실제 기준은 동일

* 기별 : 진로변신기 및 TRV 차단기 이고성장 예후

5. Weil 회로 해석

그림 3과 같은 Weil 회로에 대해서 규격에서 규정하는 제반 규정치를 만족하는 회로 정수를 계산하였다.

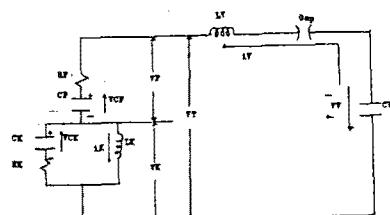


그림 3 Weil 회로

이때 규격치를 만족하는 단일 해를 구할 수는 없기 때문에 다음과 같은 계산방법을 적용하였다.

i) RK, CK, LK에 초기치 부여

ii) 근사 2P 파형을 발생하는 VV, CV, LV, RF, CF 계산

iii) i-ii 계산 결과에 의한 VT 파형을 RUNGE-KUTTA 법으로 해석

iv) 파형이 상기 규격치를 만족시키지 못할 때는 각 회로 정수변화에 따른 VT 파형 변화에 관한 예비 Data를 활용하여 관련 회로 정수치 변경

v) 규격치를 만족하고 기존 설비를 고려하여 최적이라고 판단되는 회로 정수 및 파형을 출력

이상의 계산은 Personal Computer를 이용하여 언어는 BASIC을 사용하였다

6. 실측 비교

IEC에 규정된 100KV급 이상 각종 차단기에 대한 회로

정수치를 계산하였고 그 결과를 기준 합성시험 설비를 사용한 실측치와 비교하였다. 그런데 여러가지 경우중에서

TRV의 초기 상승률이 클수록 선로정수 변화에 따른 파형 변화가 예민하기 때문에 누설 capacitance 및 결선용 선로의 inductance에 따른 오차 발생 가능성이 높으므로 170KV 31.5KA 60% BTF에 근사한 회로 정수치에서 시험을 실시하였다. 이때 실측치와 계산치를 비교하면 다음 표 2과 같은데 실제 회로 정수치와 계산치의 오차 및 기타 여건을 고려할 때 만족할 만하다.

POINT	A	B	C	D	E	P	G	I
계산치	194 69	249 218	251 357	100 135	180 287	124 64	13 210	-48 150
실측치	194 70	243 218	239.4 355	110 132	197.6 285	9.12 65	-15.2 210	-45.2 150
오차 (%)	0 +1.4	-2.4 0	-4.6 -0.8	+10 -2.1	+9.8 -0.7	-1.9 +1.8	-30 0	+5.8 0

표 2 계산치와 실측치의 비교

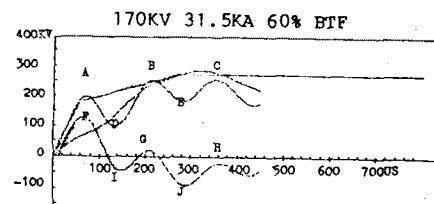


그림 4 계산 파형

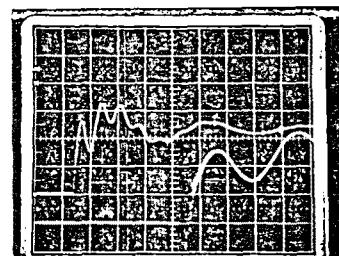


그림 5 실측 파형

TRV (VT), EV=25KV, 1V/DIV, 500US/DIV, 2000US/DIV, DIFFERENTIAL

7. 결론

지금까지는 국내 계통 최고 전압인 362KV급 차단기까지의 개발사업에 대해 검토하였으나 제작업체의 개발 계획과 보조를 맞추기 위해 현재는 762KV 1/2 절연 차단기에 대한 4P 합성 설비를 검토중에 있다. 곧 Weil 회로는 그때까

지 과도적으로 사용할 예정이며 연구 결과에 따라 적정한 시험 회로를 선택하여 다시 합성 설비를 개조 또는 보강할 예정이다.